

**XV Российский симпозиум по растровой электронной микроскопии
и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ-2007)
(ИПТМ РАН, Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН,
Научный совет РАН по электронной микроскопии, Черноголовка, 2007 г.)**

Структура пленок $\text{Ba}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{TiO}_3$, полученных химическим осаждением из растворов на подложках из поликора	
<i>О. М. Жигалина, К. А. Воротилов, Д. Н. Хмеленин, А. С. Сизов</i>	3
Атомно-силовая микроскопия поверхности зеркального скола дефектных кристаллов ТГС	
<i>Н. В. Белугина, Р. В. Гайнутдинов, А. Л. Толстихина</i>	9
Исследование в режиме наведенного тока пленок GaN, полученных методом латерального зарощивания	
<i>П. С. Вергелес, А. В. Говорков, А. Я. Поляков, Н. Б. Смирнов, Е. Б. Якимов</i>	14
Исследование сегнетоэлектрических пленок сополимера P(VDF-TrFE) и композитов на его основе методом атомной силовой микроскопии	
<i>А. В. Солнышкин, Д. А. Киселев, А. А. Богомолов, А. Л. Холкин, W. Künstler, R. Gerhard</i>	18
Исследование поверхности высокопористого кремнезема методами атомно-силовой микроскопии	
<i>С. Н. Кокорин, Е. А. Соснов, А. А. Малыгин</i>	22
Особенности пробоподготовки и исследования дисперсных наноматериалов методами атомно-силовой микроскопии	
<i>Е. А. Соснов, А. А. Малыгин</i>	25
Эпитаксиальный рост CeO_2 на кремнии и распределение концентраций элементов на границе раздела	
<i>В. Г. Бешенков, А. Г. Знаменский, В. А. Марченко</i>	31
О выборе начального приближения в задаче идентификации параметров прямозонных полупроводников методом катодолюминесцентной микроскопии	
<i>Ю. Е. Гагарин, Н. Н. Михеев, А. Н. Поляков, М. А. Степович</i>	35
Оптические керамики – строение, свойства, модели образования	
<i>М. Ш. Акчурун, Р. В. Гайнутдинов, Р. М. Закалюкин, А. А. Каминский</i>	42
Специфика исследований поверхности диэлектриков методом атомно-силовой микроскопии	
<i>А. Л. Толстихина, Р. В. Гайнутдинов, М. Л. Занавескин, К. Л. Сорокина, Н. В. Белугина, Ю. В. Грищенко</i>	48
Влияние загрязнений образцов в РЭМ на измерения линейных размеров	
<i>Ю. В. Ларионов, В. Б. Митюхляев, М. Н. Филиппов</i>	53
Влияние смазочной композиции, модифицированной нанодисперсным β -сиалоном, на структуру поверхности трения стали	
<i>Е. Н. Волнянко, С. Ф. Ермаков, В. А. Смуругов</i>	65
Анализ адгезионной прочности композиционного покрытия на основе полимерной матрицы натрий-карбоксиметилцеллюлозы с металлическим дисперсным Al-наполнителем	
<i>Н. М. Антонова, В. И. Кулинич</i>	72
Сравнение автоэмиссионных свойств систем вольфрам–полупроводник <i>n</i> - и <i>p</i> -типов проводимости	
<i>Н. В. Егоров, Л. И. Антонова, С. Р. Антонов</i>	76
Эффект частичного восстановления поверхности цинка при комнатной температуре после микроиндентирования базисной плоскости	
<i>П. В. Кузнецов, И. В. Петракова, Н. П. Бекетов</i>	79
Минеральные наночастицы в дисперсных грунтах	
<i>В. Н. Соколов, М. С. Чернов, В. Г. Шлыков, О. В. Разулина, Д. И. Юрковец, В. В. Крупская</i>	88
Квантово-размерный эффект при электронном обмене между отрицательным ионом водорода и кластером атомов алюминия	
<i>А. А. Маунов, Д. К. Шестаков, И. К. Гайнуллин, И. Ф. Уразгильдин</i>	93
Теоретические спектры диэлектрической проницаемости изоэлектронных кристаллов Ge, GaAs, ZnSe и CuBr	
<i>А. И. Калугин, В. В. Соболев</i>	97
Спектры полного комплекса оптических функций бромида кадмия в широкой области энергии 3–30 эВ	
<i>Е. В. Баранова, А. И. Калугин, В. В. Соболев, В. Вал. Соболев</i>	101
Выращивание термостабильных, прозрачных и проводящих слоев ZnO:Al методом магнетронного распыления на постоянном токе	
<i>Б. М. Атаев, В. В. Мамедов, А. М. Багамидова, С. Ш. Махмудов, А. К. Омаев</i>	106
Комплекс КГ-MEIS НИИЯФ МГУ для исследования поверхностных и нанослойных структур	
<i>П. Н. Черных, Г. А. Иферов, В. С. Куликаускас, В. С. Черныш, Н. Г. Чеченин, В. Я. Чуманов</i>	109